



Final Product/Process Change Notification

Document #:FPCN23359X

Issue Date:21 Jan 2021

Title of Change:	UDFN Wire conversion from Gold wire to Palladium coated copper wire and mold compound to Sumitomo G770HM	
Proposed First Ship date:	28 Apr 2021 or earlier if approved by customer	
Contact Information:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or MohtAzrul.Abdullah@onsemi.com	
PCN Samples Contact:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or < PCN.samples@onsemi.com >. Sample requests are to be submitted no later than 30 days from the date of first notification, Initial PCN or Final PCN, for this change. Samples delivery timing will be subject to request date, sample quantity and special customer packing/label requirements.	
Additional Reliability Data:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or MohtAzizi.Azman@onsemi.com	
Type of Notification:	This is a Final Product/Process Change Notification (FPCN) sent to customers. FPCNs are issued 90 days prior to implementation of the change. ON Semiconductor will consider this change accepted, unless an inquiry is made in writing within 30 days of delivery of this notice. To do so, contact PCN.Support@onsemi.com	
Marking of Parts/ Traceability of Change:	Will carry date code marking "PU" W21'2021 and above	
Change Category:	Assembly Change	
Change Sub-Category(s):	Material Change	
Sites Affected:		
ON Semiconductor Sites	External Foundry/Subcon Sites	
ON Semiconductor Seremban, Malaysia	None	
Description and Purpose:		
Upon the expiration of this PCN, these devices will be built with PCC wire & Sumitomo G770HM mold compound at the same site. Other BOM remain unchanged. Datasheet specifications and product electrical performance remain unchanged. Reliability qualification and full electrical characterization over temperature will be performed. The copper wire is with higher thermal conductivity and lower resistivity which benefits for customer application.		
	Before Change Description	After Change Description
Bond Wire	0.8mil Gold wire (B50607A054 – Tanaka) 2.0mil Gold wire (B50607A067– Tanaka)	0.8mil PCC CLK-1BK (N40363E011 – Tanaka) 2.0mil PCC CLR-1A (N40363E010 – Tanaka)
Mold Compound	Sumitomo G760	Sumitomo G770HM
There is no product marking change as a result of this change		

**Reliability Data Summary:**

QV1 DEVICE NAME: ESD8104MUTAG
 PACKAGE: UDFN 10 2.5*1.0*.5MM PBF
 RRF: 66166

Test	Specification	Condition	Interval	Results
HTRB	JESD22-A108	Ta=150°C, 100% max rated V	1008 hrs	0/231
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	2016 hrs	0/231
PC	J STD 020 , JESD22-A113	MSL 1 @ 260 °C		0/924
HAST	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	192 hours	0/231
TC	JESD22-A104	Ta= -55°C to +150°C, mount on board	1000 cyc	0/231
UHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs	0/231
RSH	JESD22-B106	Ta = 265C, 10 sec		0/90

QV2 DEVICE NAME: ESD8704MUTAG
 PACKAGE: UDFN 10 2.5*1.0*.5MM PBF
 RRF: 66167

Test	Specification	Condition	Interval	Results
HTRB	JESD22-A108	Ta=150°C, 100% max rated V	1008 hrs	0/231
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	2016 hrs	0/231
PC	J STD 020 , JESD22-A113	MSL 1 @ 260 °C		0/924
HAST	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	192 hours	0/231
TC	JESD22-A104	Ta= -55°C to +150°C, mount on board	1000 cyc	0/231
UHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs	0/231
RSH	JESD22-B106	Ta = 265C, 10 sec		0/90

QV3 DEVICE NAME: SNSPM0061MUT5G
 PACKAGE: UDFN2 1.6x1.0
 RRF: 66168

Test	Specification	Condition	Interval	Results
HTRB	JESD22-A108	Ta=150°C, 100% max rated V	1008 hrs	0/231
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	2016 hrs	0/231
PC	J STD 020 , JESD22-A113	MSL 1 @ 260 °C		0/924
HAST	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	192 hours	0/231
TC	JESD22-A104	Ta= -55°C to +150°C, mount on board	1000 cyc	0/231
UHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs	0/231
RSH	JESD22-B106	Ta = 265C, 10 sec		0/90

**Electrical Characteristics Summary:**

Electrical characteristics are not impacted.

List of Affected Parts:

Note: Only the standard (off the shelf) part numbers are listed in the parts list. Any custom parts affected by this PCN are shown in the customer specific PCN addendum in the PCN email notification, or on the **PCN Customized Portal**.

Part Number	Qualification Vehicle
ESD8104MUTAG	ESD8104MUTAG
ESD8040MUTAG	ESD8104MUTAG
ESD8106MUTAG	ESD8104MUTAG
ESD8118MUTAG	ESD8104MUTAG
ESD7504MUTAG	ESD8104MUTAG
ESD8116MUTAG	ESD8104MUTAG
ESD8704MUTAG	ESD8704MUTAG
ESD8006MUTAG	ESD8704MUTAG
ESD8004MUTAG	ESD8704MUTAG
ESD8504GMUTAG	ESD8704MUTAG
SESD8008MUTAG	ESD8704MUTAG
ESD8008MUTAG	ESD8704MUTAG
ESD8018MUTAG	ESD8704MUTAG
ESD8016MUTAG	ESD8704MUTAG
ESD8501V5MUT5G	SNSPM0061MUT5G
TVS8501V5MUT5G	SNSPM0061MUT5G
NSPM0051MUT5G	SNSPM0061MUT5G
NSPM0061MUT5G	SNSPM0061MUT5G
TVS8501V6MUT5G	SNSPM0061MUT5G

Japanese translation of the notification starts here.
通知の日本語訳はここから始まります。

Note: The Japanese version is for reference only. In case of any differences between the English and Japanese version, the English version shall control.

注：日本語版は参照用です。英語版と日本語版の違いがある場合は、英語版が優先されます。



最終製品 / プロセス変更通知

文書番号# : FPCN23359X

発行日: 21 Jan 2021

変更件名:	UDFN における金ワイヤからパラジウムコート銅ワイヤへの変更およびモールドコンパウンド G770HM への変更										
初回出荷予定日:	28 Apr 2021 またはお客様からの承認が得られた場合はそれ以前。										
連絡先情報:	現地のオン・セミコンダクター営業所または < MohtAzrul.Abdullah@onsemi.com > にお問い合わせください。										
サンプル:	現地のオン・セミコンダクター営業所または < PCN.Samples@onsemi.com > にお問い合わせください。 サンプルは、この変更の初回通知、初回 PCN の日付から 30 日以内に要求してください。 サンプル納入時は、依頼日、数量、特別梱包材/ラベル条件によって異なります。										
追加の信頼性データ:	お客さまの地域のオン・セミコンダクター営業所または < MohtAzizi.Azman@onsemi.com > にお問い合わせください。										
通知種別:	これは、お客様宛の最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) です。FPCN は、変更実施の 90 日前に発行されます。 オン・セミコンダクターは、この通知の送付から 30 日以内に書面による問い合わせがない限り、この変更が承諾されたものとみなします。お問い合わせは、< PCN.Support@onsemi.com > 宛てにお願いします。										
変更部品の識別:	「PU」2021 年 21 週以降の日付コードが付与されます。										
変更カテゴリ:	組立の変更										
変更サブカテゴリ:	材料の変更										
影響を受ける拠点:											
オン・セミコンダクター拠点:	外部製造工場 / 下請業者拠点:										
ON Semiconductor Seremban, Malaysia	無し										
説明および目的:	<p>本 PCN の期限切れに伴い、これらの製品は同じ拠点で PCC ワイヤおよび住友製モールド・コンパウンド G770HM を用いて製造されるようになります。他の BOM に変更はありません。データシートの規格および製品の電気的性能に変更はありません。信頼性認定と温度範囲全体にわたる電気的特性評価は実施されます。銅ワイヤは熱伝導率が高く、抵抗率が低いので、お客様のアプリケーションにメリットをもたらします。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>処理</th> <th>変更前の表記</th> <th>変更後の表記</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ボンドワイヤ</td> <td>0.8mil Gold wire (B50607A054 – Tanaka) 2.0mil Gold wire (B50607A067 – Tanaka)</td> <td>0.8mil PCC CLK-1BK (N40363E011 – Tanaka) 2.0mil PCC CLR-1A (N40363E010 – Tanaka)</td> </tr> <tr> <td>モールド・コンパウンド</td> <td>Sumitomo G760</td> <td>Sumitomo G770HM</td> </tr> </tbody> </table> <p>今回の変更に伴う製品マーキングの変更はありません。</p>		処理	変更前の表記	変更後の表記	ボンドワイヤ	0.8mil Gold wire (B50607A054 – Tanaka) 2.0mil Gold wire (B50607A067 – Tanaka)	0.8mil PCC CLK-1BK (N40363E011 – Tanaka) 2.0mil PCC CLR-1A (N40363E010 – Tanaka)	モールド・コンパウンド	Sumitomo G760	Sumitomo G770HM
処理	変更前の表記	変更後の表記									
ボンドワイヤ	0.8mil Gold wire (B50607A054 – Tanaka) 2.0mil Gold wire (B50607A067 – Tanaka)	0.8mil PCC CLK-1BK (N40363E011 – Tanaka) 2.0mil PCC CLR-1A (N40363E010 – Tanaka)									
モールド・コンパウンド	Sumitomo G760	Sumitomo G770HM									



信頼性データの要約:

デバイス名: ESD8104MUTAG

RMS: UDFN 10 2.5*1.0*.5MM PBF

パッケージ: 66166

テスト	仕様	条件	間隔	結果
HTRB	JESD22-A108	Ta=150°C, 100% max rated V	1008 hrs	0/231
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	2016 hrs	0/231
PC	J STD 020, JESD22-A113	MSL 1 @ 260 °C		0/924
HAST	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	192 hours	0/231
TC	JESD22-A104	Ta= -55°C to +150°C, mount on board	1000 cyc	0/231
UHASt	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs	0/231
RSH	JESD22-B106	Ta = 265C, 10 sec		0/90

デバイス名: ESD8704MUTAG

RMS: UDFN 10 2.5*1.0*.5MM PBF

パッケージ: 66167

テスト	仕様	条件	間隔	結果
HTRB	JESD22-A108	Ta=150°C, 100% max rated V	1008 hrs	0/231
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	2016 hrs	0/231
PC	J STD 020, JESD22-A113	MSL 1 @ 260 °C		0/924
HAST	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	192 hours	0/231
TC	JESD22-A104	Ta= -55°C to +150°C, mount on board	1000 cyc	0/231
UHASt	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs	0/231
RSH	JESD22-B106	Ta = 265C, 10 sec		0/90

デバイス名: SNSPM0061MUT5G

RMS: UDFN2 1.6x1.0

パッケージ: 66168

テスト	仕様	条件	間隔	結果
HTRB	JESD22-A108	Ta=150°C, 100% max rated V	1008 hrs	0/231
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	2016 hrs	0/231
PC	J STD 020, JESD22-A113	MSL 1 @ 260 °C		0/924
HAST	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	192 hours	0/231
TC	JESD22-A104	Ta= -55°C to +150°C, mount on board	1000 cyc	0/231
UHASt	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs	0/231
RSH	JESD22-B106	Ta = 265C, 10 sec		0/90

**電気的特性の要約:**

電気的特性への影響はありません。

影響を受ける部品の一覧:

注: 部品一覧には標準部品番号 (既製品) のみが記載されています。本 PCN の影響を受けるカスタム部品番号は、PCN メールで提供される顧客個別の付録、または PCN カスタマイズポータルに記載されています。

部品番号	認定試験用ピークル
ESD8104MUTAG	ESD8104MUTAG
ESD8040MUTAG	ESD8104MUTAG
ESD8106MUTAG	ESD8104MUTAG
ESD8118MUTAG	ESD8104MUTAG
ESD7504MUTAG	ESD8104MUTAG
ESD8116MUTAG	ESD8104MUTAG
ESD8704MUTAG	ESD8704MUTAG
ESD8006MUTAG	ESD8704MUTAG
ESD8004MUTAG	ESD8704MUTAG
ESD8504GMUTAG	ESD8704MUTAG
SESD8008MUTAG	ESD8704MUTAG
ESD8008MUTAG	ESD8704MUTAG
ESD8018MUTAG	ESD8704MUTAG
ESD8016MUTAG	ESD8704MUTAG
ESD8501V5MUT5G	SNSPM0061MUT5G
TVS8501V5MUT5G	SNSPM0061MUT5G
NSPM0051MUT5G	SNSPM0061MUT5G
NSPM0061MUT5G	SNSPM0061MUT5G
TVS8501V6MUT5G	SNSPM0061MUT5G